



Docket No. 1232-5283

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant(s): Yoshiki KINO

Group Art Unit: TBA

Serial No.: 10/776,717

Examiner: TBA

Filed: February 11, 2004

For: COOLING APPARATUS, OPTICAL ELEMENT HAVING THE SAME, AND
EXPOSURE APPARATUS

CERTIFICATE OF MAILING (37 C.F.R. §1.8(a))

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

I hereby certify that the attached:

1. Claim to Convention Priority w/ document\
2. Certificate of Mailing
3. Return postcard receipt

along with any paper(s) referred to as being attached or enclosed and this Certificate of Mailing are being deposited with the United States Postal Service on date shown below with sufficient postage as first-class mail in an envelope addressed to the: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

Respectfully submitted,
MORGAN & FINNEGAN, L.L.P.

Dated: April ²⁹, 2004

By: _____

Helen Tiger

Correspondence Address:

MORGAN & FINNEGAN, L.L.P.
345 Park Avenue
New York, NY 10154-0053
(212) 758-4800 Telephone
(212) 751-6849 Facsimile



CUSTOMER NO. 27123

Docket No. 1232-5283

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant(s): Yoshiki KINO

Group Art Unit: TBA

Serial No.: 10/776,717

Examiner: TBA

Filed: February 11, 2004

For: COOLING APPARTUS, OPTICAL ELEMENT HAVING THE SAME, AND
EXPOSURE APPARATUS

CLAIM TO CONVENTION PRIORITY

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

In the matter of the above-identified application and under the provisions of 35 U.S.C. §119 and 37 C.F.R. §1.55, applicant(s) claim(s) the benefit of the following prior application(s):

Application(s) filed in: Japan

In the name of: Canon Kabushiki Kaisha

Serial No(s): 2003-034956

Filing Date(s): February 13, 2003

- ☒ Pursuant to the Claim to Priority, applicant(s) submit(s) a duly certified copy of said foreign application.
- ☐ A duly certified copy of said foreign application is in the file of application Serial No. _____, filed _____.

Dated: April 28, 2004

Respectfully submitted,
MORGAN & FINNEGAN, L.L.P.

By:


Joseph A. Calvaruso

Registration No. 28,287

Correspondence Address:
MORGAN & FINNEGAN, L.L.P.
345 Park Avenue
New York, NY 10154-0053
(212) 758-4800 Telephone
(212) 751-6849 Facsimile



日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 2 月 1 3 日
Date of Application:

出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 0 3 4 9 5 6
Application Number:
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 3 - 0 3 4 9 5 6]

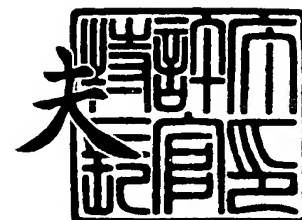
出 願 人 キヤノン株式会社
Applicant(s):



2 0 0 4 年 3 月 1 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



【書類名】 特許願

【整理番号】 252464

【提出日】 平成15年 2月13日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 H01L 21/54

【発明の名称】 冷却装置、それを有する光学部材並びに露光装置

【請求項の数】 1

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都大田区下丸子 3 丁目 3 0 番 2 号 キヤノン株式会社
社内

 【氏名】 木野 芳樹

【特許出願人】

 【識別番号】 000001007

 【氏名又は名称】 キヤノン株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100110412

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 藤元 亮輔

 【電話番号】 03-3523-1227

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 062488

 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

 【物件名】 明細書 1

 【物件名】 図面 1

 【物件名】 要約書 1

 【包括委任状番号】 0010562

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 冷却装置、それを有する光学部材並びに露光装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 凹部を有する光学部材の前記凹部に配置され、前記光学部材を輻射を利用して非接触で冷却する冷却機構を有することを特徴とする冷却装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、一般には、冷却装置に係り、特に、半導体ウエハ用の単結晶基板、液晶ディスプレイ（LCD）用のガラス基板などの被処理体を露光する露光装置に用いられる光学素子を冷却する冷却装置に関わる。本発明は、例えば、露光光源として紫外線や極端紫外光（EUV：Extreme Ultraviolet）光を利用する露光装置に用いられる光学素子を冷却する冷却装置に好適である。

【0002】

【従来の技術】

近年、半導体素子の製造のためのリソグラフィ工程において実用最小線幅（デバイスルール）50nm以下の回路パターンを基板（ウエハ等）に転写するための次世代の露光装置として、波長5～20nm、例えば、波長13nm、11nm等のEUV光を露光光として用いるEUV露光装置の開発が進んでいる。

【0003】

EUV光は従来の水銀ランプやエキシマレーザによる紫外線と比べて、波長が一桁以上も短く、それに伴う光学的な要求も厳しくなっている。更に、EUV光はその波長の特性上、既存の硝材、例えば、石英や蛍石など、を透過することができないため、従来の透過／屈折光学系を用いることができず、マスクを含む全てのEUVリソグラフィ光学系は反射ミラーを使用する。また、反射ミラーに形成される膜はモリブデン（Mo）／ケイ素（Si）からなる多層膜をコーティングしたものが主流であるが、この多層膜の特性は入射光線の角度によって反射率が異

なり、おおよそ 7 0 % 前後である。従って、入射光線のうち、反射されない部分はミラーに吸収されて熱源となり、ミラー面を熱変形させるという問題が発生する。そのため、ミラーの材料は温度変化によってミラー形状の変化を小さくするために線膨張係数の小さな材料を使用している。しかしながら、E U V 露光装置は 0 . 1 μ m 以下の回路パターンの露光に使用されるため、線幅精度が非常に厳しく、ミラー面は 0 . 1 n m 程度以下の変形しか許容されない。従って、ミラーの線膨張係数が 1 0 p p b の場合でも、温度上昇に伴ってミラー面は変形し、例えば、ミラーの厚さが 5 0 m m の場合は、0 . 2 $^{\circ}$ C の温度上昇によりミラーの面形状が 0 . 1 n m 変化する。かかる問題を解決するため、特許文献 1 はペルチェ素子・ヒートパイプ等を直接ミラーに接触させ、伝熱によりミラーを冷却する方法を提案している。

【特許文献 1】

特開平 1 1 - 2 4 3 0 5 2

【0 0 0 4】

【発明が解決しようとする課題】

しかし、特許文献 1 はペルチェ素子・ヒートパイプ等がミラーに直接接触しているため、これらに設けられた冷却ジャケットに流入する液体等の振動により、ミラー面を変形させるおそれがある。また、ヒートパイプがミラー面に直接接触している部分に応力が発生し、面変形を発生させてしまうという問題もある。上述のように、ミラー面の変形は、結像性能を劣化させ、所望の線幅を得られないという問題を招くので好ましくない。

【0 0 0 5】

そこで、本発明は、光学部材の変形を防止又は低減して所望の光学性能をもたらす冷却装置及び方法、当該冷却装置を有する露光装置を提供することを例示的な目的とする。

【0 0 0 6】

【課題を解決するための手段】

本発明の一側面としての冷却装置は、凹部を有する光学部材の前記凹部に配置され、前記光学部材を輻射を利用して非接触で冷却する冷却機構を有することを

特徴とする。

【0007】

【発明の実施の形態】

以下、図1及び図2を参照して、本発明による第1の実施形態の冷却装置200とそれを有する光学部材100について説明する。ここで、図1(a)は、光学部材100の概略断面図であり、図1(b)は、冷却装置200の冷却ジャケット230の概略断面図である。光学部材100は、本実施形態では、ミラーとして機能する基部110と、基部110を輻射により非接触に冷却する冷却装置200とを有する。本実施形態では、光学部材100は、真空又は減圧環境下に配置されるが、本発明は、光学部材100が配置される環境を限定するものではない。

【0008】

基部110は、表面としての被照射面112と、それに対向する裏面120とを有する。被照射面112は被照射領域114と非照射領域116とを有し、被照射領域114には、光束Lが入射する。被照射領域114に対応する裏面120には凹部130が形成されている。凹部130に冷却装置200が配置される。ミラーとして機能する基部110は、ミラーの熱膨張による影響を低減するために低熱膨張材、具体的には、SHOTT社のZERODURやCORNING社のULEを使用している。

【0009】

冷却装置200は、保持部材202と、支持板204と、輻射板210と、ペルチェ素子220と、冷却ジャケット230と、配管240と、支持板250とを有する。冷却装置200は、輻射により基部110を冷却すればよく、本発明は、ペルチェ素子220や冷却ジャケット230などの構造に限定されるものではない。

【0010】

保持部材202は基部110を保持する。支持板204は保持部材202に接続して、ミラーの全体重量を支持する。輻射板210は、熱伝導率が良く輻射率が高い材料、例えば、セラミック材や金属材料から構成され、その表面には輻射

率を高めるために表面状態は粗くし、表面に処理を施すなどを行っている。輻射板 2 0 4 が対向する凹部 1 3 0 の底面は輻射板と同様に輻射の効果を上げる処理が施されている。

【0 0 1 1】

ペルチェ素子 2 2 0 は、輻射板 2 1 0 を冷却する。ペルチェ素子 2 2 0 は輻射板 2 1 0 の表面にメタライズ処理を行い、融着されている。冷却ジャケット 2 3 0 は、発熱したペルチェ素子 2 2 0 を冷却させる熱交換器として機能する。図 1 b は冷却ジャケット 2 3 0 の内部の構造を示す。同図に示すように、冷却ジャケット 2 3 0 の内部には、流体の脈動を伝達させないような流路 2 3 2、例えば、渦が発生しないような流路 2 3 2、が設けられている。ペルチェ素子 2 2 0 は冷却ジャケット 2 3 0 に対しても輻射板 2 1 0 に対して同様な処理を施し融着されている。

【0 0 1 2】

配管 2 4 0 は、冷却ジャケット 2 3 0 を冷却するための配管であり、冷却ジャケット 2 3 0 の流路 2 3 2 に接続されている。配管 2 4 0 に供給される流体は熱交換に適した水その他の冷媒である。配管 2 4 0 の表面には配管 2 4 0 からの輻射を防止するため断熱材が巻きつけられている。

【0 0 1 3】

支持板 2 5 0 は、輻射板 2 1 0、ペルチェ素子 2 2 0、冷却ジャケット 2 3 0、配管 2 4 0 からなる冷却構造を支持する。支持板 2 5 0 と支持板 2 0 4 は不図示の鏡筒等の構造体に支持されるが、各々は別の構造体に支持されている。

【0 0 1 4】

図 2 は、光学部材 1 0 0 の透過平面図である。同図において、斜線が書かれている部分は輻射板 2 1 0 と被照射領域 1 1 4 を示している。輻射板 2 1 0 は被照射領域 1 1 4 の大きさ以上であれば輻射の効果を得ることができる。

【0 0 1 5】

基部 1 1 0 の被照射面 1 1 2 に光束 L、例えば、露光光が入射すると、被照射面 1 1 2 はその光のエネルギー量に伴って発熱する。その熱源は基部 1 1 0 内部を伝導して凹部 1 3 0 の底面に伝わる。輻射板 2 1 0 はペルチェ素子 2 2 0 で予

め計算しておいた入射エネルギー量に相当する熱量を吸収できるよう冷却しておく。

【0 0 1 6】

ここで、ペルチェ素子 2 2 0 の裏面側はその素子の特性により発熱する。そのため、冷却ジャケット 2 3 0 は配管 2 4 0 から水等を流すことにより、ペルチェ素子 2 2 0 の発熱分を吸収可能な構造としている。この時、ペルチェ素子 2 2 0 の発熱量は輻射板 2 1 0 を冷却する際に発生する量であり、予め計算可能である。これにより、基部 1 1 0 の凹部 1 3 0 を冷却することが可能となり、被照射面 1 1 2 の熱変形を抑制することが可能となる。

【0 0 1 7】

上記説明したようにミラー基部 1 1 0 の裏面 1 2 0 を繰り抜き、凹部 1 3 0 を設け、その内部に冷却装置 2 0 0 を配置することにより、熱伝導率が低い材料を基部 1 1 0 に用いても被照射面 1 1 2 と凹部 1 3 0 の底面の間隔が狭くなるので冷却効率を上げることが可能となる。

【0 0 1 8】

また、冷却装置 1 0 0 が基部 1 1 0 の内部に配置されているので、基部 1 1 0 以外のものを冷却することが無い。例えば、従来の冷却装置であれば輻射によってミラーの保持部材を冷却してしまい、保持部材を熱変形させてしまうこともあったが、本実施形態ではそのような問題は生じない。

【0 0 1 9】

以下、図 3 を参照して、本発明による第 2 の実施形態の光学部材 1 0 0 A について説明する。ここで、図 3 は、光学部材 1 0 0 A の概略断面図である。本実施形態の光学部材 1 0 0 A は冷却装置 2 0 0 A を有し、冷却装置 2 0 0 A は、輻射板 2 1 0 や冷却ジャケット 2 3 0 から放射される熱をミラーの凹部の底面以外に伝達させないためのカバーを有する。図 3 において、2 6 0 は断熱カバーであり、輻射板 2 1 0 の下面から放射される熱及び冷却ジャケット 2 3 0 から放射される熱を遮断する。2 6 2 はボルトであり、断熱カバー 2 6 0 を支持板 2 5 0 に固定する。輻射板 2 1 0 からの輻射熱は基部 1 1 0 の凹部 1 3 0 の底面に対して行われるので、その面に対してのみ冷却することが可能となり、凹部 1 3 0 の壁面

の変形が原因となる被照射面 112 の変形を防止することができる。

【0020】

以下、図 4 及び図 5 を参照して、本発明による第 3 の実施形態の光学部材 100A について説明する。ここで、図 4 は、光学部材 100A の概略断面図であり、図 5 は、光学部材 100A の基部 110A の部分透過平面図である。本実施形態の光学部材 100A は基部 110A と冷却装置 200A とを有する。

【0021】

基部 110A は、凹部 130 に加えて、凹部 140 を有する点で基部 110 と相違し、図 4 及び図 5 においてハッチングされている。凹部 140 は、被照射領域 114 を囲むように非照射領域 116 に対向する裏面 120 に設けられており、基部 110A の軽量化に寄与している。凹部 140 の形状及び深さは基部 110A 全体の剛性を考慮して形成される必要があり、例えば、円形やいわゆるエッグクレート状など他の形状を有してもよい。本実施形態では、図 5 に示すように、複数の凹部 140 の形状は異なっているが、同一でもよいし、その個数も限定されない。

【0022】

以下、図 6 を参照して、本発明による第 4 の実施形態の光学部材 100B について説明する。ここで、図 6 は、光学部材 100B の概略断面図である。本実施形態の光学部材 100B は基部 110B と冷却装置 200B とを有する。

【0023】

基部 110B は、被照射面 112A が凸形状である点で基部 110A と相違する。図 6 において太線で示す凹部 130A を形成する裏面 120A の形状は被照射面 112A と凹部 130A の間隔がほぼ等しくなるように加工してある。

【0024】

また、冷却装置 200B は、輻射板 210A が凹部 130A の形状にならって凸形状に又は近似的に斜めに形成されている。これに合わせて、ペルチェ素子 220A 及び冷却ジャケット 230A の形状も凸形状に又は近似的に斜めに形成されている。このため、基部 110B の凹部 130A における温度分布がほぼ一様であれば、被照射面 112A に伝導する分布も一様になる。なお、本実施形態の

輻射板 210A は繰り抜き部の形状に平行としているが、より厳密には双方の間で輻射形態係数（ある物体から出たエネルギーが別の物体へ到達する割合）を計算し、最も高くなるように配置することが好ましい。また、図 6 は被照射面 112 が凸形状を有する例を示しているが、被照射面 112 が凹形状を有していてもよい。

【0025】

以下、図 7 及び図 8 を参照して、本発明による第 5 の実施形態の光学部材 100C について説明する。ここで、図 7 は、光学部材 100C の基部 110C の部分透過平面図であり、被照射面 112 における温度分布を示している。図 8 は、光学部材 100C の概略断面図である。本実施形態の光学部材 100C は基部 110C と冷却装置 200A とを有する。

【0026】

基部 110C は、被照射面 112 の温度分布に従って凹部 130A の形状を変更している点で基部 110A と相違する。図 7 に示すように、被照射領域 114 には、図 7 に示すような温度分布 A 乃至 D が発生する。ここで、温度 A 乃至 D には $D > C > B > A$ の関係が成立するものとする。凹部 130A は、かかる温度分布の影響を除去できるように、基部 110C 内で断面的に階段状に形成されている。凹部 130A は、温度が高くなるところは肉厚を薄く、温度が低くなるところは厚くしてある。温度分布に基づき深さは、入射光によって生じる温度分布が被照射面 112 で生じないように予め計算しておくことにより可能となる。なお、ここでは凹部 13 の形状を階段状にしたが、一般に温度分布は勾配を有しているので滑らかな面で凹部 130A が形成されてもよい。この結果、本実施形態の光学部材 100C の被照射領域 114 に温度勾配が形成されることを防止することができる。

【0027】

なお、温度分布によって冷却能力を変化すればよいので、凹部 130 の形状を凹部 130A のように変更するほか、輻射板 210 の形状を変更したり（例えば、温度が高いところ（中央部）をより基部 110 に近づけるなど）、冷却能力を変更したり（例えば、ペルチェ素子 220 による冷却を中央部で高めるなど）し

てもよい。

【0028】

以下、図9及び図10を参照して、本発明による第6の実施形態の光学部材100Dについて説明する。ここで、図9は、光学部材100Dの概略断面図である。本実施形態の光学部材100Cは基部110Aと冷却装置200Cとを有する。冷却装置200Cは、温度検出器276を有する点で冷却装置200Aと相違する。温度検出器276は、基部110Aの被照射領域114の裏面120に取り付けられており、基部110Aの（被照射領域114の）温度を検出している。これにより、被照射面112の温度を予測することが可能となる。必要があれば、図7に示す温度分布を測定するために、複数の温度検出器276が設けられてもよい。

【0029】

以下、図10を参照して、温度検出器276を使用した温度制御システムについて説明する。ここで、図10(a)は、温度制御システム（の制御系）270を示すブロック図である。図10(b)は、温度制御方法を示すフローチャートである。

【0030】

温度制御システム270は、制御部272と、メモリ274と、温度検出部276とを有する。制御部272は、CPU、MPUなど名称のいかんを問わず、基部110Aを温度制御する機能を有する。メモリ274は、RAM、ROM、ハードディスクなどから構成され、図10(b)に示す温度制御方法、それに使用される値（初期温度、設定温度など）を格納する。温度検出器276は、上述のように、基部110の温度を検出し、各種の温度センサから構成可能である。

温度検出器276の位置は設計上、制御上の要請から適宜変更可能であり、上述のように、その個数はミラー形状に合わせて変更可能である。温度検出器276は基部110Aの被照射面112に更に配置されてもよく、裏面120の温度検出器276による計測を補間しながら制御されてもよい。更に、温度検出器276は、輻射板210の上面に配置されてもよい。もちろん、基部110Aは、他の基部110、110B、110Cなどに変更されてもよい。

【0031】

以下、図10(b)を参照して温度制御方法について説明する。まず、入射光Lがない状態での基部110Aの温度を温度検出器276で計測し、設計温度をメモリ274に格納しておく(ステップ1002)。次に、光、例えば、露光光Lの照射を開始する(ステップ1004)。また、光照射と同時に基部110Aの温度を温度検出器276で計測する(ステップ1006)。

【0032】

制御部272は、温度検出器276の計測温度と基部110Aに対して予めメモリ274に格納しておいた設計温度とを比較する(ステップ1008)。両者を比較して温度検出器276が計測した温度が高ければ、ペルチェ素子220を動作させ、輻射板210を冷却する。温度検出器276では、ペルチェ素子220によって冷却される温度を随時モニタし、その値を制御部272へ転送し、ペルチェ素子220の動作を制御する。反対に温度が低いようであれば、制御部272はペルチェ素子220の動作を停止する。以上の動作において、冷却ジャケット230には、配管240から、ペルチェ素子220の発熱分を吸収可能な流量の水等の液体を流しておく。

【0033】

入射露光光Lに伴う温度上昇を温度検出器276で常にモニタすることが可能となるので、リアルタイムで被照射面112上での温度変形を防止することが可能となる。

【0034】

以下、図11を参照して、本発明の一実施形態の露光装置300について説明する。ここで、図11は、露光装置300の単純化された光路を示す図である。露光装置300は、露光用の照明系としてEUV光(例えば、波長13.4nm)を用いて、例えば、ステップ・アンド・スキャン方式やステップ・アンド・リピート方式でマスク340に形成された回路パターンを被処理体に露光する投影露光装置である。

【0035】

露光装置300は、サブミクロン以下のリソグラフィ工程に最適であり、以下

、ステップ・アンド・スキャン方式の露光装置を例に説明する。このステップ・アンド・スキャン方式とは、マスクに対してウエハを連続的に走査してマスクパターンをウエハに露光すると共に、1ショットの露光終了後ウエハをステップ移動して、次の露光領域に移動する露光方法である。

図11において、302は真空チャンバである。EUV光は大気に残存する残留ガス（例えば炭化水素等）と反応してコンタミを発生させ、ミラー面の反射率を低下させるという現象があるため、光学系が収まる中は減圧又は真空雰囲気（ 1×10^{-6} [Pa] 程度）となっている。310は光源であり、例えば、レーザプラズマ光源が用いられる。これは、真空容器中のターゲット材に高強度のパルスレーザ光を照射し、高温のプラズマを発生させ、照射される波長13nm程度のEUV光を利用するものである。

【0036】

320は照明光学系であり、光源310から射出されたEUV光を後述するマスク340に均一照射するための光学系であり、図11では記していないが数枚のミラー及び照明領域を円弧状に限定するためのアパーチャが設けられている。本実施形態の冷却装置を有する光学部材は照明光学系320に適用することができる。本実施形態の光学部材を使用することにより、照明光学系320は、ミラー面の面変形を抑制することができ、優れた結像性能を発揮することができる。

【0037】

330は投影光学系である。投影光学系330は複数の反射ミラーを用いてマスク340面上のパターンを像面であるウエハ360面上に縮小投影する。投影光学系330におけるミラー枚数は4枚乃至6枚で構成する。本図において、ミラー面の裏面には冷却構造250が設けられている。上述のように、冷却構造250は支持板204に支持されており、冷却構造250で発生する振動はミラー面に伝達しないようになっている。また、ミラーの照射面に対向する裏面を繰り抜いているので、ミラー内の熱伝導時間を低減させることができ、冷却効果を上げることが可能となる。

【0038】

340はマスクである。マスク340は反射型マスクで、マスク面上には転写

されるべき回路パターンが形成されている。マスク 340 は後述するマスクステージ 350 に支持されている。マスク 340 は後述するウエハ 360 と光学的に共役の関係に配置されている。

【0039】

350 はマスクステージであり、マスク 340 を支持している。マスクステージ 350 は不図示の移動機構に接続されており、移動機構の例としてはリニアモータなどである。リニアモータによりマスク 340 及びウエハ 360 を同期した状態で走査させる。また、マスクステージ 350 は不図示のアライメント検出機構により適正な位置に駆動することが可能である。ここで、アライメント検出機構はマスク 340 の位置と投影光学系 330 の光軸との位置関係、及び、ウエハ 360 の位置と投影光学系 330 の光軸との位置関係を計測し、マスク 340 の投影像がウエハ 360 の所定の位置に一致するようにマスクステージ 350 と後述するウエハステージ 370 の位置と角度を設定する。

【0040】

360 は被露光体であるが、本実施形態ではウエハである。被露光体 360 は液晶基板その他の被処理体を広く含む。被露光体にはフォトレジストが塗布されている。フォトレジスト塗布工程は、前処理と、密着性向上剤塗布工程と、フォトレジスト塗布処理と、プリベーク処理とを含む。前処理は、洗浄、乾燥などを含む。密着性向上剤塗布処理は、フォトレジストと下地との密着性を高めるための表面改質（即ち、界面活性剤塗布による疎水性化）処理であり、HMDS（Hexamethyldisilazane）などの有機膜をコート又は蒸気処理する。プリベークは、ベーキング（焼成）工程であるが現像後のそれよりもソフトであり、溶剤を除去する。

【0041】

370 はウエハステージであり、ウエハ 360 は不図示のウエハチャックによって支持されている。ウエハステージ 370 は、例えば、リニアモータによって、走査方向（以下 X 方向）、走査方向と直交する方向（以下 Y 方向）、被露光体 360 の有する面の法線方向（以下 Z 方向）に被露光体 360 を移動する。被露光体 360 は前記したように、マスク 340 と同期して移動する。ここで、ウエ

ハステージ 3 7 0 は不図示のフォーカス検出機構により動作する。フォーカス検出機構は被露光体 3 6 0 面で Z 方向のフォーカス位置を計測し、ウエハステージ 3 7 0 の位置及び角度を制御することによって、露光中、常時被露光体 3 6 0 面を投影光学系 3 3 0 による結像位置を保つ。

【 0 0 4 2 】

以上、本冷却構造を露光装置に適応した例を示した。本発明の冷却構造は E U V 光に限定することなく、他のエキシマレーザ光にも適応することが可能である。また、マスクやウエハなどにも適応することが可能である。

【 0 0 4 3 】

本実施形態の光学部材 1 0 0 によれば、被照射面 1 1 2 に対向する裏面 1 2 0 を繰り抜くことにより、被照射面 1 1 2 と裏面 1 2 0 間の距離が短くなり、また、光学部材 1 0 0 に接触することなく冷却することが可能となるので、光学部材 1 0 0 の熱膨張を低減させて所望の光学性能を実現させることが可能となる。

【 0 0 4 4 】

また、本実施形態においては、主に冷却について述べてきたが、本実施形態は冷却に限らず、光学部材を温度調節することに適用しても構わない。

【 0 0 4 5 】

次に、図 1 2 及び図 1 3 を参照して、上述の露光装置 3 0 0 を利用したデバイスの製造方法の実施例を説明する。図 1 2 は、デバイス（I C や L S I などの半導体チップ、L C D、C C D 等）の製造を説明するためのフローチャートである。ここでは、半導体チップの製造を例に説明する。ステップ 1（回路設計）ではデバイスの回路設計を行う。ステップ 2（マスク製作）では、設計した回路パターンを形成したマスクを製作する。ステップ 3（ウエハ製造）ではシリコンなどの材料を用いてウエハを製造する。ステップ 4（ウエハプロセス）は前工程と呼ばれ、マスクとウエハを用いてリソグラフィ技術によってウエハ上に実際の回路を形成する。ステップ 5（組み立て）は後工程と呼ばれ、ステップ 4 によって作成されたウエハを用いて半導体チップ化する工程であり、アッセンブリ工程（ダイシング、ボンディング）、パッケージング工程（チップ封入）等の工程を含む。ステップ 6（検査）では、ステップ 5 で作成された半導体デバイスの動作確認

テスト、耐久性テストなどの検査を行う。こうした工程を経て半導体デバイスが完成し、これが出荷（ステップ7）される。

【0046】

図13は、ステップ4のウェハプロセスの詳細なフローチャートである。ステップ11（酸化）ではウェハの表面を酸化させる。ステップ12（CVD）では、ウェハの表面に絶縁膜を形成する。ステップ13（電極形成）では、ウェハ上に電極を蒸着などによって形成する。ステップ14（イオン打ち込み）ではウェハにイオンを打ち込む。ステップ15（レジスト処理）ではウェハに感光剤を塗布する。ステップ16（露光）では、露光装置1によってマスクの回路パターンをウェハに露光する。ステップ17（現像）では、露光したウェハを現像する。ステップ18（エッチング）では、現像したレジスト像以外の部分を削り取る。ステップ19（レジスト剥離）では、エッチングが済んで不要となったレジストを取り除く。これらのステップを繰り返し行うことによってウェハ上に多重に回路パターンが形成される。

【0047】

本出願は更に以下の事項を開示する。

【0048】

（実施態様1） 凹部を有する光学部材の前記凹部に配置され、前記光学部材を輻射を利用して非接触で冷却する（温度調節する）冷却機構を有することを特徴とする冷却装置。

【0049】

（実施態様2） 光が照射される被照射面と第1の凹部とを有する基部と、前記第1の凹部に配置され、輻射を利用して前記基部を非接触で冷却する冷却機構を有することを特徴とする光学部材。

【0050】

（実施態様3） 前記第1の凹部は前記被照射面の被照射領域に対向して配置されることを特徴とする実施態様2記載の光学部材。

【0051】

（実施態様4） 前記冷却機構は、

前記基部に対向して配置された輻射板と、
前記輻射板を冷却するペルチェ素子とを有することを特徴とする実施態様 2 記載の光学部材。

【 0 0 5 2 】

(実施態様 5) 前記冷却機構は、冷媒が流れるための流路を有し、前記ペルチェ素子の排熱を回収する冷却ジャケットを更に有することを特徴とする実施態様 4 記載の光学部材。

【 0 0 5 3 】

(実施態様 6) 前記冷却機構が前記第 1 の凹部において取得した熱を前記基部が吸収することを防止するための断熱部材を更に有することを特徴とする実施態様 2 記載の光学部材。

【 0 0 5 4 】

(実施態様 7) 前記基部は、非照射領域において前記第 1 の凹部とは異なる位置に設けられた第 2 の凹部を更に有する実施態様 2 記載の光学部材。

【 0 0 5 5 】

(実施態様 8) 前記第 2 の凹部は、前記被照射面の非照射領域に対向して形成されることを特徴とする実施態様 7 記載の光学部材。

【 0 0 5 6 】

(実施態様 9) 前記被照射領域と前記第 1 の凹部との間隔はほぼ一定であることを特徴とする実施態様 3 記載の光学部材。

【 0 0 5 7 】

(実施態様 1 0) 前記第 1 の凹部の形状は前記被照射面の温度分布に対応して変化していることを特徴とする請求項 3 記載の光学部材。

【 0 0 5 8 】

(実施態様 1 1) 前記冷却装置は、前記被照射面の温度分布に対応して、位置に基づく冷却力を変化させることを特徴とする請求項 3 記載の光学部材。

【 0 0 5 9 】

(実施態様 1 2) 前記光学部材は、ミラーを含むことを特徴とする請求項 2 記載の光学部材

(実施態様 1 3) 前記基部の温度を検出する検出部と、
前記検出部の検出する前記基部の温度が所定の値となるように、前記冷却機構を制御する制御部とを更に有することを特徴とする実施態様 2 記載の光学部材。

【0 0 6 0】

(実施態様 1 4) 光が照射される被照射面に対向して形成された凹部を有することを特徴とする光学部材。

【0 0 6 1】

(実施態様 1 5) 請求項 2 乃至 1 4 のうちいずれか一項記載の光学部材を有する光学系を有し、マスク又はレチクルに形成されたパターンを被処理体に露光することを特徴とする露光装置。

【0 0 6 2】

(実施態様 1 6) 実施態様 1 5 記載の処理装置としての露光装置を用いて被露光体を投影露光する工程と、

前記投影露光された被露光体に所定のプロセスを行う工程とを有するデバイス製造方法。

【0 0 6 3】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、光学部材の変形を防止又は低減して所望の光学性能をもたらす冷却装置及び当該冷却装置を有する露光装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 図 1 (a) は、本発明による第 1 の実施形態の光学部材の概略断面図であり、図 1 (b) は、図 1 (a) に示す冷却装置の冷却ジャケットの概略断面図である。

【図 2】 図 1 (a) に示す光学部材の透過平面図である。

【図 3】 本発明による第 2 の実施形態の光学部材の概略断面図である。

【図 4】 本発明による第 3 の実施形態の光学部材の概略断面図である。

【図 5】 図 4 に示す光学部材の基部の部分透過平面図である。

【図 6】 本発明による第 4 の実施形態の光学部材の概略断面図である。

【図 7】 本発明による第 5 の実施形態の光学部材の基部の部分透過平面図であり、被照射面における温度分布を示している。

【図 8】 図 7 に示す光学部材の概略断面図である。

【図 9】 本発明による第 6 の実施形態の光学部材の概略断面図である。

【図 1 0】 図 9 に示す光学部材に適用可能な、温度制御システムのブロック図と温度制御方法を示すフローチャートである。

【図 1 1】 本発明の一実施形態の露光装置の単純化された光路図である。

【図 1 2】 図 1 1 に示す露光装置のデバイス製造方法を説明するためのフローチャートである。

【図 1 3】 図 1 2 に示すステップ 4 の詳細なフローチャートである。

【符号の説明】

1 0 0、1 0 0 A-D	光学部材
1 1 0、1 1 0 A-C	基部（ミラー）
1 1 2	被照射面
1 1 4	被照射領域
1 1 6	非照射領域
1 2 0	裏面
1 3 0、1 3 0 A	凹部
1 4 0	凹部
2 0 0、2 0 0 A-C	冷却装置
2 1 0、2 1 0 A	輻射板
2 2 0、2 2 0 A	ペルチェ素子
2 3 0、2 3 0 A	冷却ジャケット
2 5 0	冷却構造
2 6 0	断熱カバー
2 7 2	制御部
2 7 6	温度検出器
3 0 0	露光装置
3 2 0	照明光学系

3 3 0

投影光学系

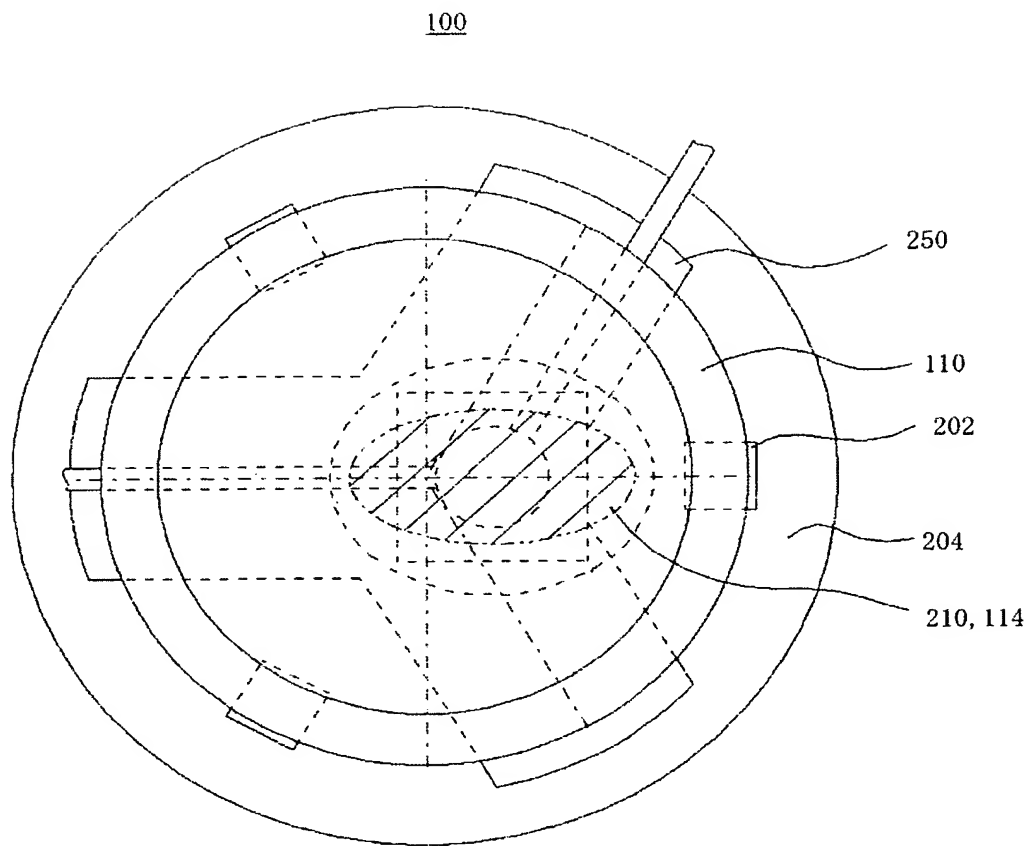
3 4 0

マスク

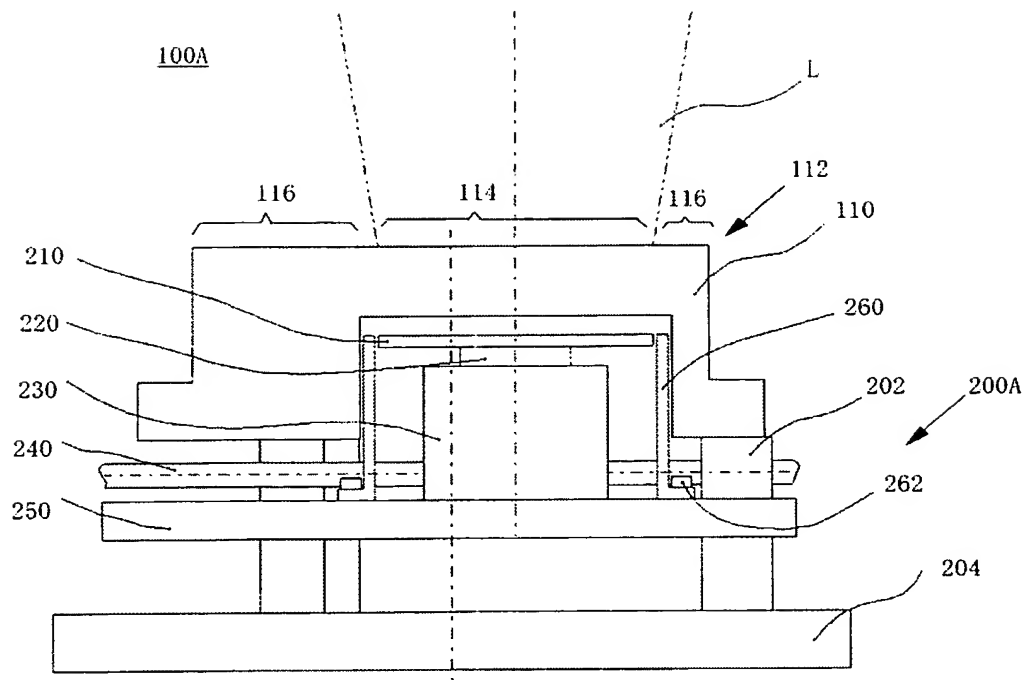
3 6 0

被露光体（ウエハ）

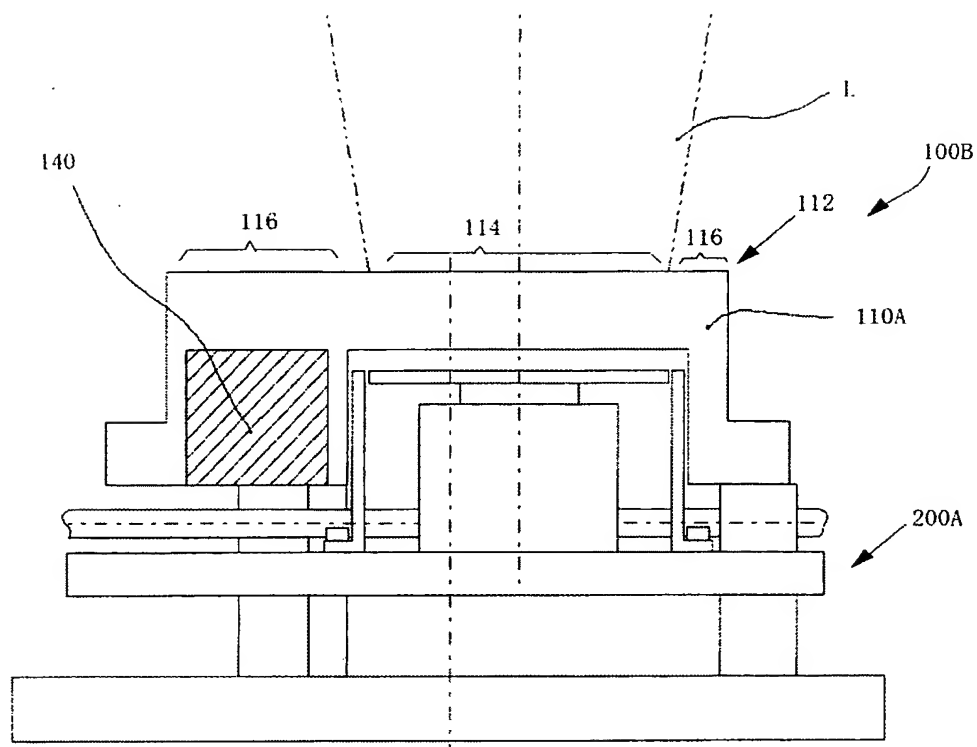
【図 2】



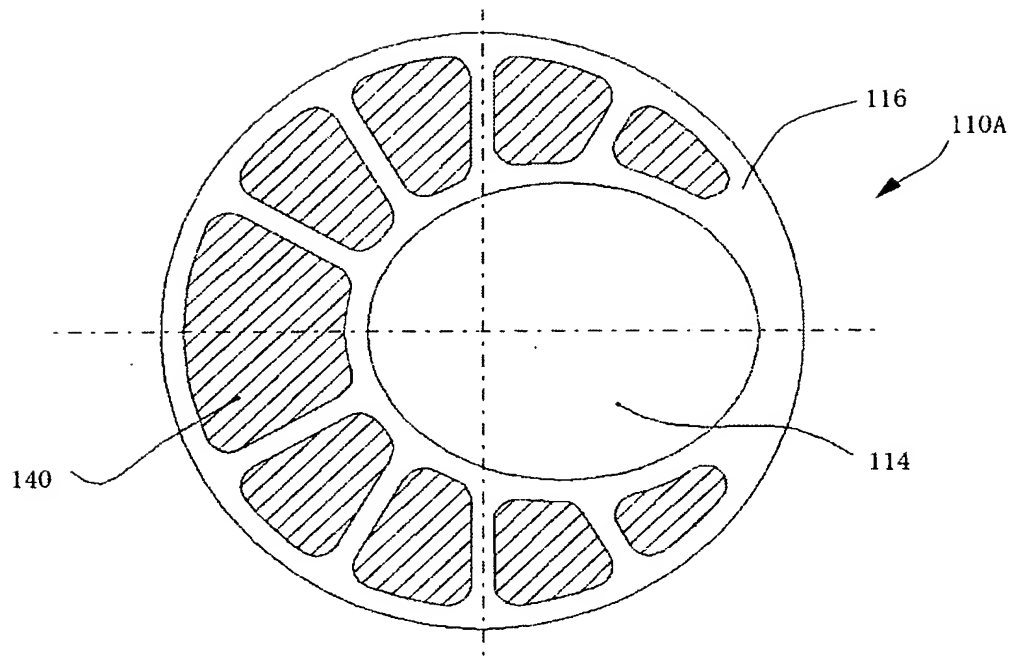
【図 3】



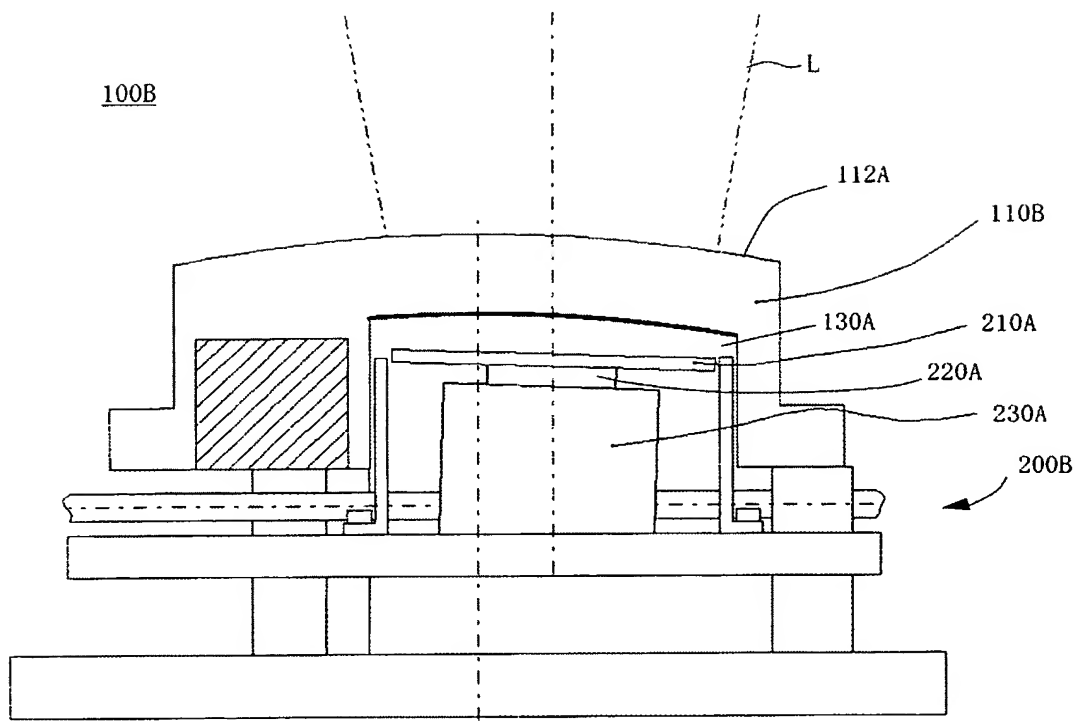
【図 4】



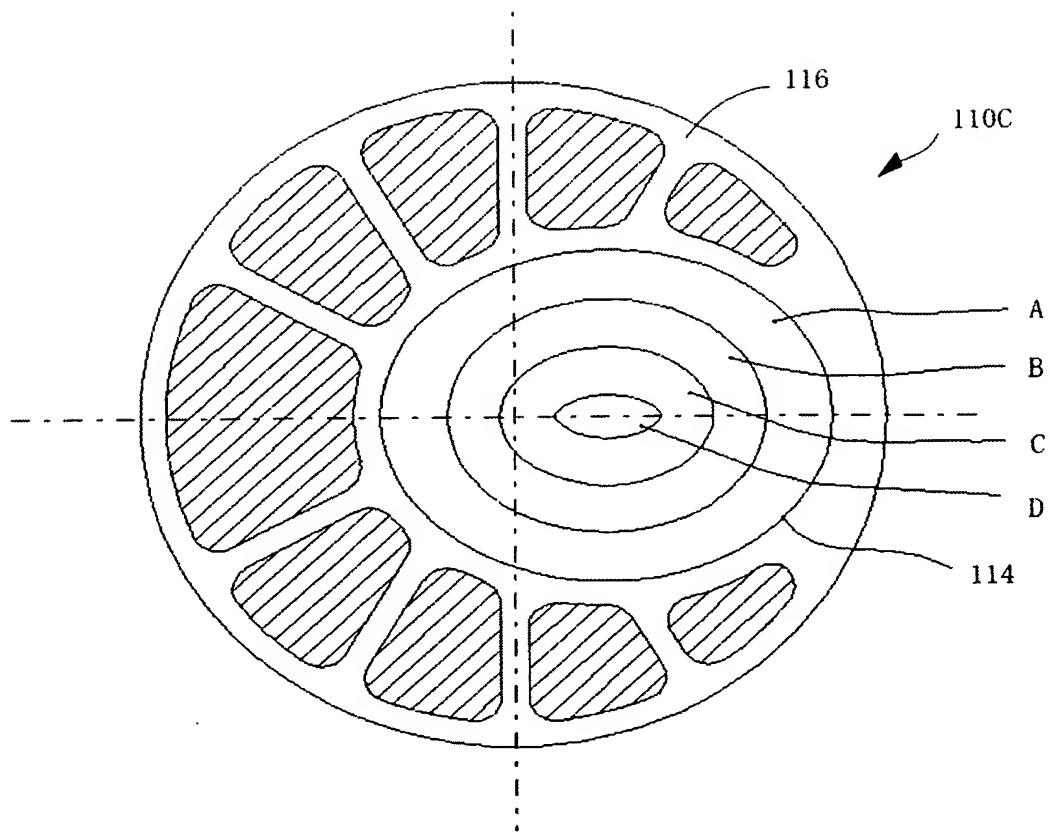
【図 5】



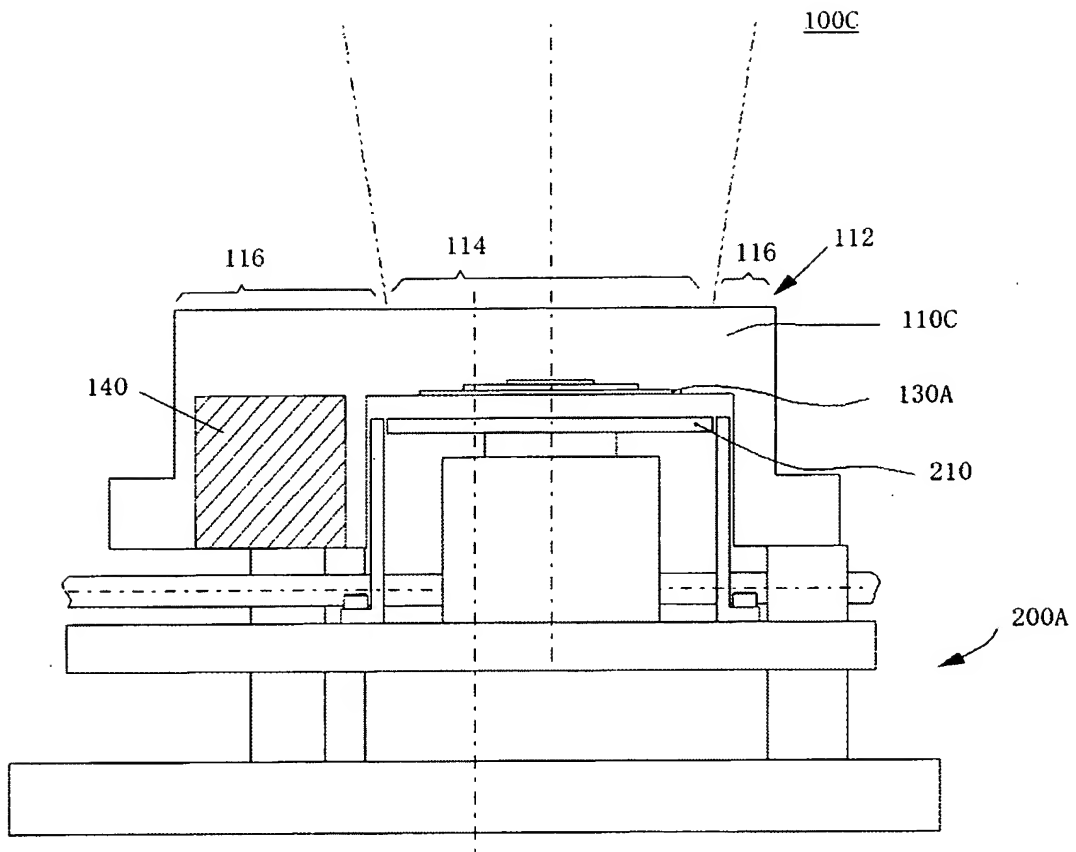
【図 6】



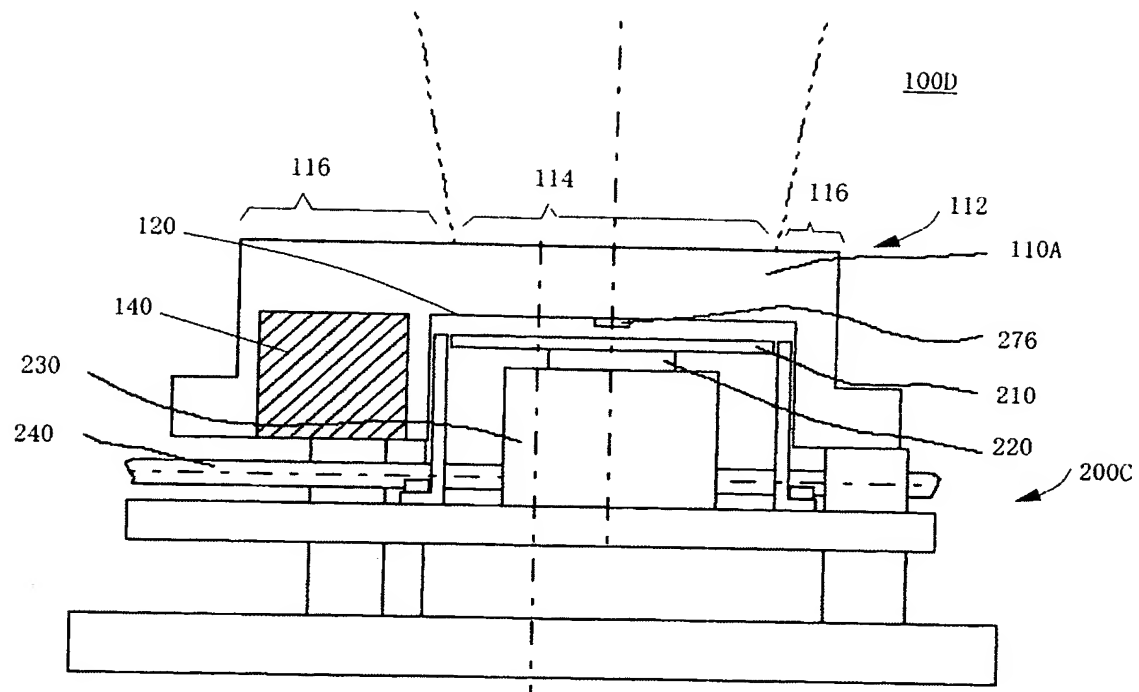
【図 7】



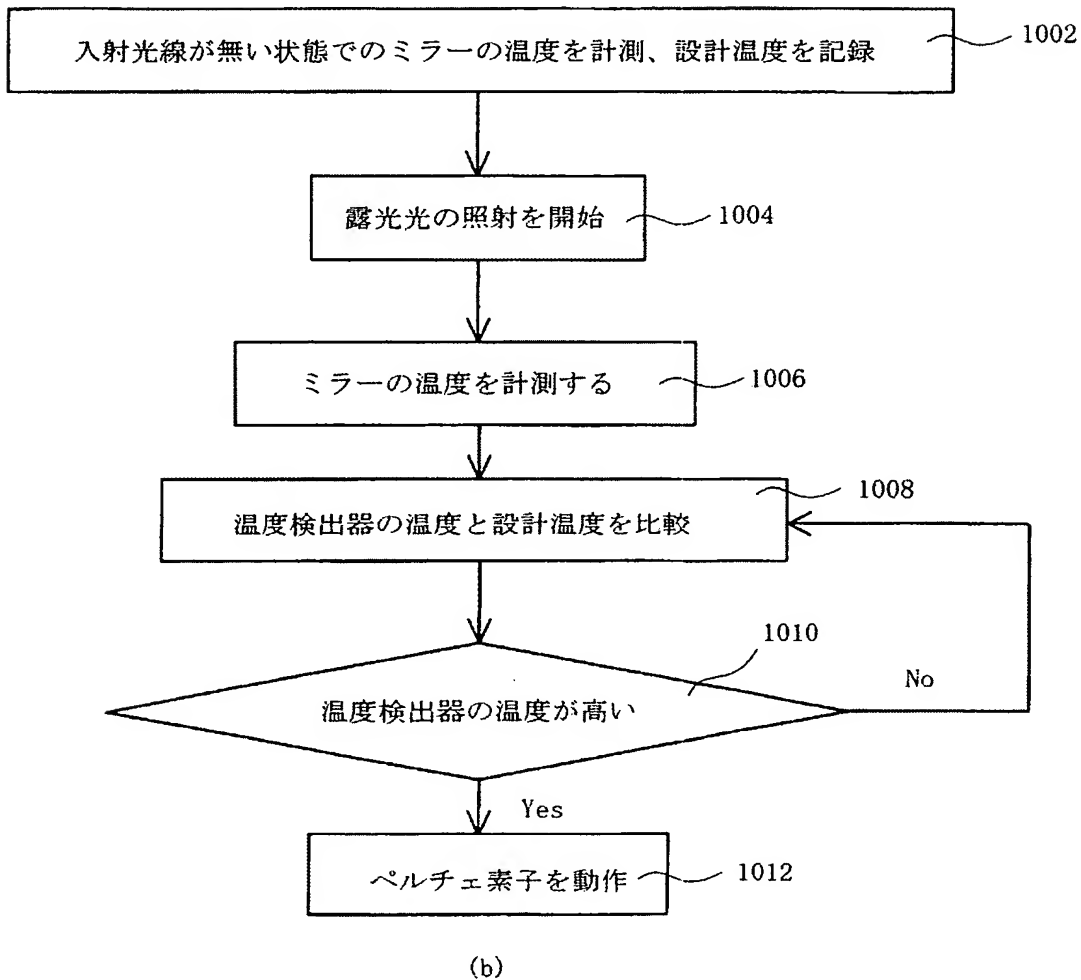
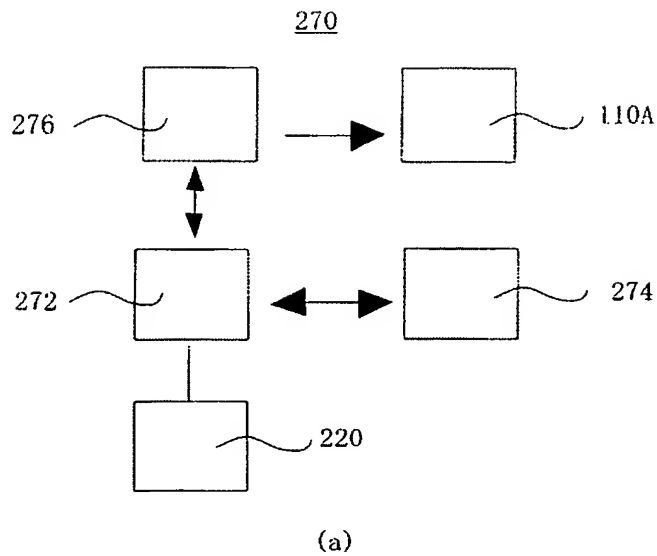
【図 8】



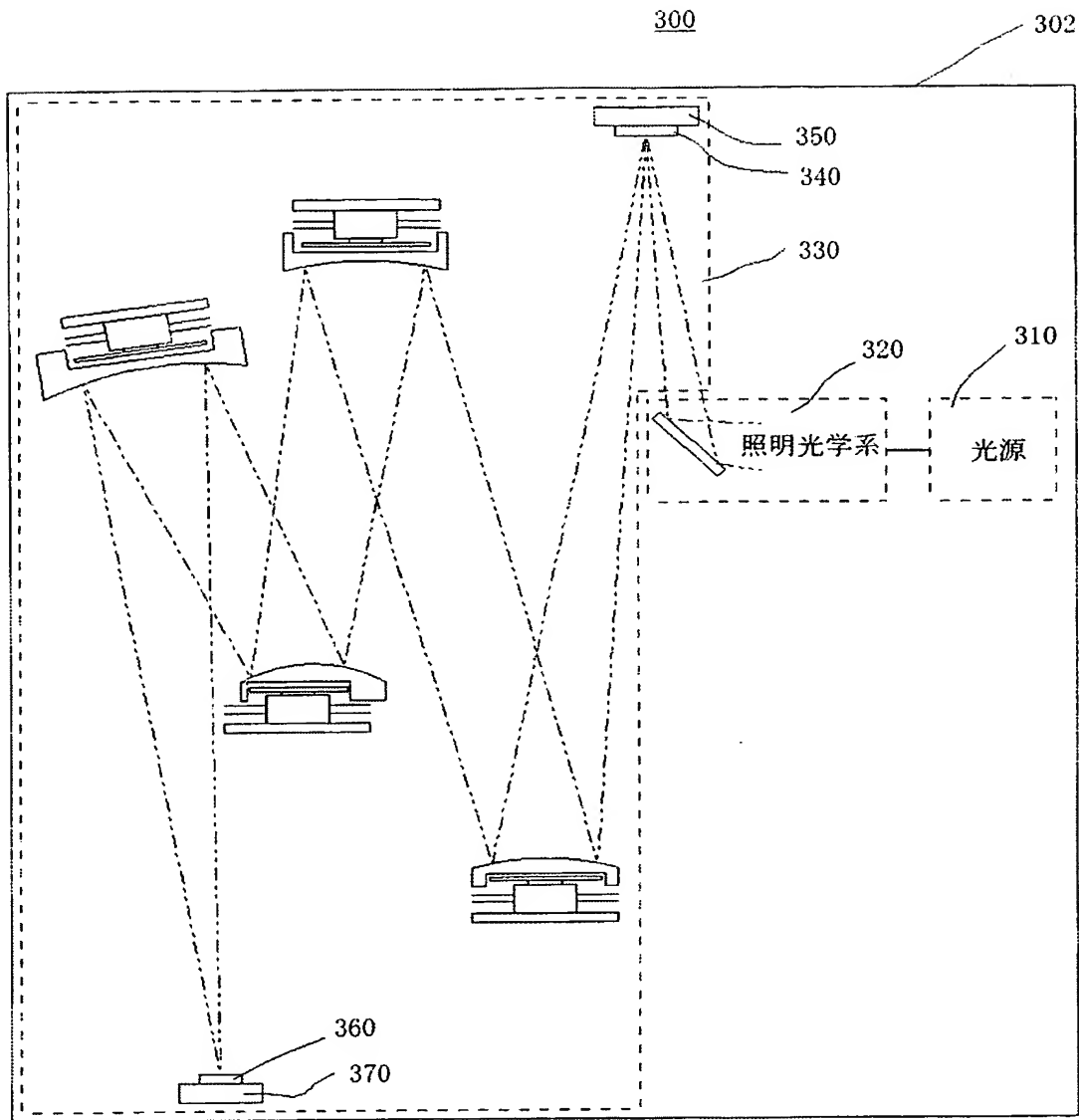
【図 9】



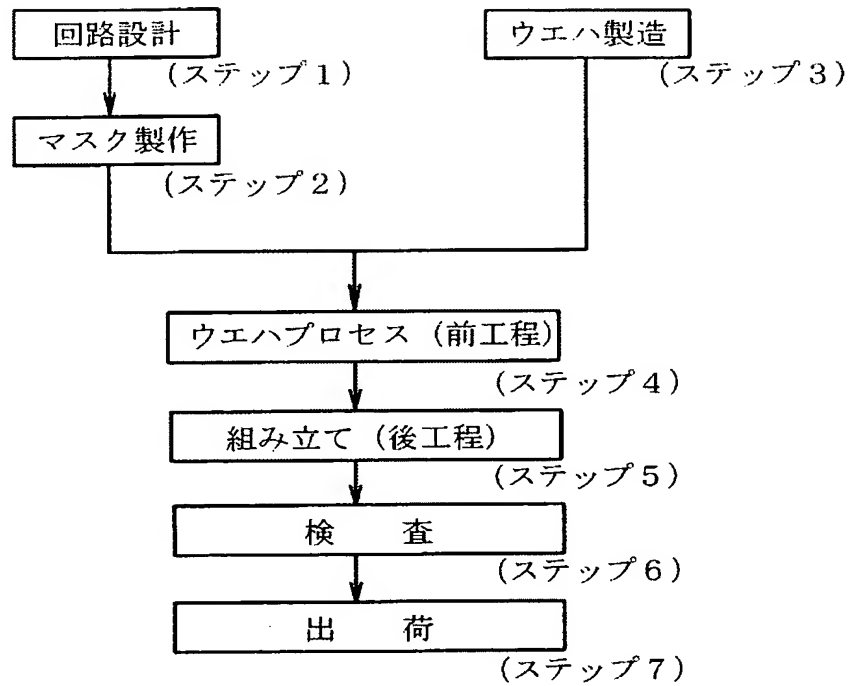
【図 10】



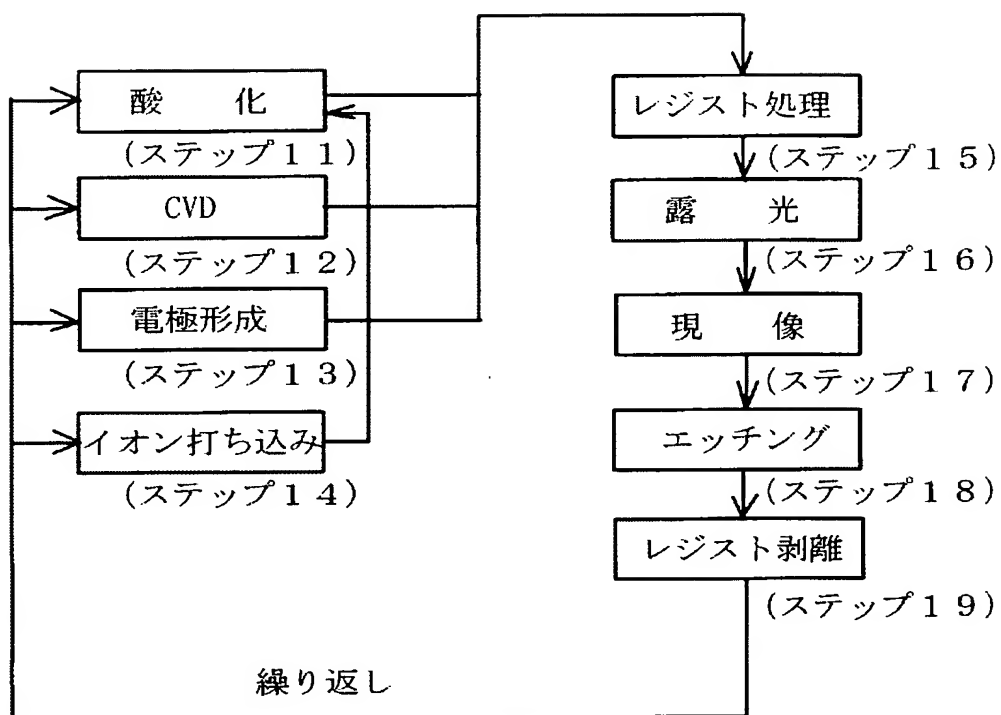
【図 11】



【図 12】



【図 13】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 光学部材の変形を防止又は低減して所望の光学性能をもたらす冷却装置及び方法、当該冷却装置を有する露光装置を提供する。

【解決手段】 凹部を有する光学部材の前記凹部に配置され、前記光学部材を輻射を利用して非接触で冷却する冷却機構を有することを特徴とする冷却装置を提供する。

【選択図】 図 1

特願 2 0 0 3 - 0 3 4 9 5 6

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 1 0 0 7]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 3 0 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都大田区下丸子 3 丁目 3 0 番 2 号

氏 名

キャノン株式会社